

日本信頼性学会誌「信頼性」

Vol.44 No.6 2022.11月号

(通巻268号)

目 次

お知らせ	i
目 次	v
巻 頭 言	
対面？ オンライン？ それともハイブリッド？	高橋 聖 329
展 望	
「ミニマルファブがもたらす半導体技術の信頼性」	
高いロバスト性を有する超小型半導体製造システム・ミニマルファブ	原 史朗 330
ミニマルファブがもたらす半導体の信頼性技術	原 史朗, クンプアン ソマワシ 337
ミニマルファブによる SOI-CMOS ロジック IC の試作評価	森川 剛一, 新藤 浩之 347
Minimal Fab ビジネスの現状と課題	永井 亨 356
信頼性教室「基礎講座」	
Excel を用いた統計解析	
＝ 6 章：世の中は確率だ・・・指数及び、2 項、ポアソン、幾何分布”	
	真田 克 362
報 告	
2022 年度第 1 回見学会報告	
横河ソリューションサービス株式会社—ミニマルアプリケーションラボ—	
	鎗木 俊暁 370
学会情報	
2022 年度第 3 回理事会（第 279 回日本信頼性学会理事会）議事録	総務委員会 371
会員状況	374
編集後記	真田 克 375
第 44 巻総目次	378
広 告	
	大同信号株式会社 iii
	一般財団法人日本科学技術連盟 iv

The Journal of Reliability Engineering Association of Japan

Vol.44 No.6 November 2022

Content

Preface

In-person? Online? Or Hybrid? Sei TAKAHASHI 329

Special Survey

“Reliability of Semiconductor Technology brought with Minimal Fabs”

Ultra-Small and Robust Semiconductor Fab System – Minimal Fab Shiro HARA 330

Semiconductor Reliability in Minimal Fab Shiro HARA, Sommawan KHUMPUANG 337

Fabrication and Evaluation of SOI-CMOS Logic IC by Minimal Fab
..... Koichi MORIKAWA, Hiroyuki SHINDOU 347

Minimal Fab Business Status and Challenges Tooru NAGAI 356

Tutorial

Statistical Analysis By Using Excel Masaru SANADA 362

Report

2022.1st Visiting Report of REAJ Toshiaki KABURAGI 370

From Editor Masaru SANADA 375

Published by Reliability Engineering Association of Japan